



XAFS 測定装置(ビームライン 11S2)

中部経済産業局記者会、瀬戸市記者会、豊田市政記者クラブ、豊田市政記者東クラブ 同時

平成 29 年 7 月 13 日 (木)
あいち産業科学技術総合センター
共同研究支援部シンクロトロン光活用推進室
担当 中西、野本、柴田、中川
ダイヤルイン 0561-76-8315
愛知県産業労働部産業科学技術課
管理・調整グループ
担当 山田、佐野、林
内線 3389、3388
ダイヤルイン 052-954-6347

シンクロトロン光計測分析に関する講習会の参加者を募集します 「シンクロトロン光計測入門講習会 ～XAFS 測定原理から解析まで～」

知の拠点あいち内の「あいちシンクロトロン光センター^{※1}(以下、AichiSR)」は、分子や原子レベルで物質の組成等を解析できる、ナノテク研究に不可欠な最先端の計測分析施設であり、現在、測定手法別に 10 本のビームライン^{※2}を供用しています。

今回、その測定手法の中でも利用率が高く、またユーザーからの解析の要望も多い X 線吸収微細構造(以下、XAFS^{※3})に焦点を当てた「シンクロトロン光計測入門講習会(XAFS 測定原理から解析まで)」を平成 29 年 8 月 21 日(月)に開催します。

これから XAFS を測定される方や XAFS の解析に関心のある方を主な対象として、XAFS の原理から解析までを分かりやすく説明します。

参加費は無料です。多くの皆様に御参加いただきますよう、御案内申し上げます。

1 日時

平成29年8月21日(月) 午後1時から午後5時30分まで

2 場所

あいち産業科学技術総合センター 1階 講習会室

豊田市八草町秋合1267-1 (電話：0561-76-8315)

※会場へは公共交通機関を利用してお越しください。

東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南駅」下車北側すぐ

3 主催等

主催：愛知県、公益財団法人科学技術交流財団、
大学連合(名古屋大学・名古屋工業大学・豊橋技術科学大学・豊田工業大学)

共催：愛知工研協会

協賛：光ビームプラットフォーム

4 内容

- (1) 講演（午後1時5分～午後1時15分）
「AichiSRビームライン紹介」
内容：AichiSR 各ビームラインの紹介
講師：あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部 のもと とよかず 野本 豊和
- (2) 講演（午後1時15分～午後2時25分）
「XAFS測定入門」
内容：XAFSの「原理」から「何が分かるのか」までを説明
講師：名古屋大学 教授 たぶち まさお 田渕 雅夫 氏
- (3) 講演（午後2時40分～午後3時40分）
「XAFS解析入門」
内容：解析ソフトAthena^{アテナ}によるXAFSデータの解析方法を説明
講師：名古屋大学 技術職員 おおじ ひろし 陰地 宏 氏
- (4) 講演（午後3時40分～午後4時40分）
「XAFS解析の実用例、研究事例」
内容：解析ソフトArtemis^{アルテミス}によるXAFS解析を研究で用いた例を紹介
講師：名古屋大学 助教 おがわ さとし 小川 智史 氏
- (5) 個別相談会（※希望者のみ）（午後4時40分～午後5時30分）

5 参加費

無料

6 定員

80名（申込先着順）

7 申込方法

- ・技術開発に取り組む企業の方々を始め、どなたでも自由に参加できます。
- ・Web申込み(http://www.astf-kha.jp/synchrotron/userguide/event/2017_2.html)又は申込書に必要事項を記入の上、FAX、郵送又は電子メールでお申し込みください。
- ・申込書はあいち産業科学技術総合センターのWebサイト(<http://www.aichi-inst.jp/>)からダウンロードできます。

8 申込期限

平成29年8月18日（金）午後5時（必着）

※定員に達し次第締め切ります。

※参加受付証は発行しません。お申込みの上、直接会場にお越しください。なお、定員超過により、御参加いただけない場合は連絡させていただきます。

9 申込先及び問合せ先

あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部

シンクロトロン光活用推進室（担当：中西、野本、柴田、中川）

〒470-0356 豊田市八草町秋合1267-1

電話：0561-76-8315 FAX：0561-76-8317

mail：BL-riyou@chinokyoten.pref.aichi.jp

URL：http://www.aichi-inst.jp/

【用語説明】

用語	説明
※1 あいちシンクロトロン光センター	<p>(公財) 科学技術交流財団が整備・運営する、ナノテク研究に不可欠な最先端の計測分析施設 (平成 25 年 3 月オープン)。 産業利用を主目的とし、隣接する「あいち産業科学技術総合センター」(運営主体: 愛知県) が備える高度計測分析機器との相互利用によって、地域企業の技術的な課題解決を強力に支援する。</p>
※2 ビームライン	<p>シンクロトロン光を用いて計測分析を行う測定装置。あいちシンクロトロン光センターでは、幅広い企業ニーズに対応するため測定手法別に合計 10 本を供用している。測定するもの(試料)に合わせたビームラインを利用することにより、多種多様な分析を、汎用機器と比較して短時間かつ高精度に行うことができる。</p>
※3 XAFS(ザフス)	<p>X 線吸収微細構造測定法のこと。X 線の吸収量は物質を構成する元素や化学状態により異なることから、X 線のエネルギーを変えながら、測定した吸収量を解析することで、測定対象元素の電子構造や化学状態に関する情報を得ることができる。</p>